

《オミクロン ナノテクノロジー ジャパン株式会社》

ランチョンミーティング

2013年 11月26日 12:10-12:50

G会場 202B

最新の表面ナノキャラクタリゼーション評価技術

Hysitronのナノインデンテーション
OmicronのSTM/AFM/XPS/GCIB

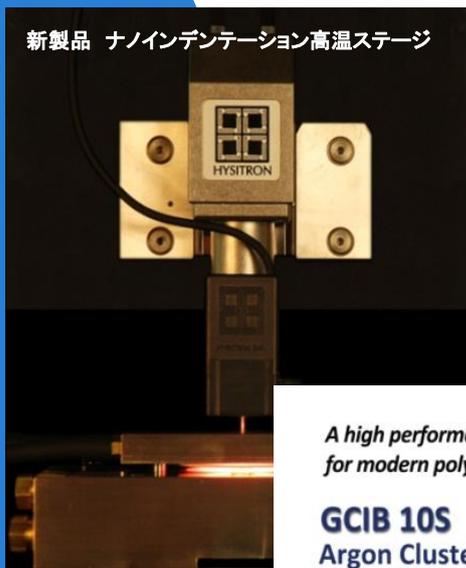
By 技術部長 富塚 仁

11月28日 15:30 ~ D会場 201A

Ian Thomas Clark 発表！

28Dp10 ナノインデンテーション法を用いる樹脂の動的機械特性の温度、周波数依存性の評価

新製品 ナノインデンテーション高温ステージ



*A high performance ion beam
for modern polymer analysis.....*

GCIB 10S
Argon Cluster Ion Beam System



The **NEW** Fermi SPM

A compact LT SPM with flow
cryostat:

- 15 - 400 K
- Tip and sample cooled
- In-situ tip exchange & 2D coarse
- Low thermal drift
- STM, AFM & spectroscopy
- Sub pA STM

